

for all  $A \subset S$   
 $0 \leq P(A) \leq 1$

$P(S) = 1$

$A \cap A_j = \emptyset, j=1, \dots, n$   
 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$



# یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

11<sup>th</sup>

Seminar on Probability and Stochastic Processes

۸ و ۹ شهریور ۱۳۹۶

30-31 August 2017

آدرس دبیرخانه:  
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه  
تلفن و دورنویس دبیرخانه ۰۲۸-۳۳۹۰۱۳۷۹

آدرس صفحه وب سمینار:  
<https://spsp11.conf.ikiu.ac.ir>  
ایمیل سمینار:  
[spsp11@conf.ikiu.ac.ir](mailto:spsp11@conf.ikiu.ac.ir)

## مقایسه شاخص کارایی $C_{pmk}$ دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته

محیا قاسمی، زهره پروانه، مهدی جباری نوقابی

گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

**چکیده:** شاخص‌های کارایی فرایند برای اندازه‌گیری کارایی فرایند استفاده می‌شوند. در حالت‌هایی مثل انتخاب تامین‌کننده‌ی بهتر و ارزیابی پیشرفت فرایند، مقایسه‌ی شاخص‌های کارایی دو فرایند متفاوت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته برای نسبت شاخص کارایی  $C_{pmk}$  دو فرایند متفاوت و انجام آزمون فرضیه‌ی مناسب با ارایه یک مثال، این مقایسه انجام گرفته است. شاخص کارایی  $C_{pmk}$  بر اساس این فرض است که فرایند مورد نظر دارای توزیع نرمال با میانگین  $\mu$  و انحراف معیار  $\sigma$  می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** شاخص‌های کارایی فرایند، فاصله اطمینان تعمیم یافته.

### ۱ مقدمه

هر کارخانه‌ای محصولاتش را با این هدف که آن‌ها را به مشتریان زیادی به فروش می‌رساند و به سود بیش‌تری دست می‌یابد، تولید می‌کند. مصرف‌کنندگان تنها محصولاتی را که با انتظاراتشان مطابقت دارد تقاضا می‌کنند. بنابراین، فرایند تولید باید قابلیت تولید محصولی با کیفیت مورد انتظار را داشته باشد. هنگامی که فرایند تولید تحت کنترل آماری است، شاخص‌های کارایی فرایند برای اندازه‌گیری کارایی فرایند به کار برده می‌شوند. بیشترین ارزیابی در مورد شاخص‌های کارایی فرایند تنها روی برآورد نقطه‌ای آنها متمرکز است و بنابراین این امکان وجود دارد که اظهار نظرهای غیر قابل اعتمادی درباره‌ی کارایی فرایند صورت پذیرد. به عبارت دیگر استفاده از شاخص‌های کارایی فرایند بخش مهمی از کاربردهای

کنترل فرایندهای آماری برای دستیابی به پیشرفت های مستمر در کیفیت به شمار می‌رود. شاخص‌های کارایی فرایند مانند  $C_p$ ،  $C_{pk}$ ،  $C_{pm}$  و  $C_{pmk}$  برای فراهم آوردن یک اندازه‌ی کمی از عملکرد ساخت در صنایع و یا اندازه‌گیری کارایی یک محصول به کار برده می‌شوند. بسیاری از آماردان‌ها و مهندسين کیفیت بر پژوهش روی شاخص‌های کارایی فرایند به منظور پیشنهاد روش‌های مؤثرتری در مورد سنجش کارایی فرایند تأکید می‌کنند. شاخص کارایی یک اندازه بر اساس پارامترهای فرایند و حدود مشخصات فنی است.

شاخص‌های شناخته شده ی  $C_p$ ،  $C_{pk}$ ،  $C_{pm}$  و  $C_{pmk}$  بر اساس این فرض هستند که فرایند مورد نظر دارای توزیع نرمال با میانگین  $\mu$  و انحراف معیار  $\sigma$  است. اگر  $U$  و  $L$  به ترتیب نشان دهنده ی حد مشخصه فنی بالا و پایین و  $T$  مقدار هدف باشد، این شاخص‌ها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$C_p = \frac{U - L}{6\sigma},$$

$$C_{pk} = \min\left(\frac{U - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - L}{3\sigma}\right),$$

$$C_{pm} = \frac{U - L}{6\sqrt{\sigma^2 + (\mu - T)^2}}$$

و

$$C_{pmk} = \frac{\min(USL - \mu, \mu - LSL)}{3\sqrt{\sigma^2 + (\mu - T)^2}}.$$

در این مقاله فرض شده است حدود مشخصات فنی  $(L, U)$  و مقدار هدف  $T$  برای دو فرایند یکسان است.

یک فاصله اطمینان دقیق برای  $C_p$  با استفاده از توزیع کی دو به دست می‌آید. برای مقایسه‌ی دو شاخص  $C_{pmk}$  ساختارهای فاصله اطمینان دقیق نیستند و فواصل اطمینان فقط بر حسب روش‌های تقریبی حاصل می‌شود.

در ادامه فاصله اطمینان تعمیم یافته برای  $\frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  محاسبه می‌شود و با استفاده از این فاصله اطمینان آزمون فرضیه مربوطه انجام می‌گیرد.

## ۲ مقایسه شاخص کارایی $C_{pmk}$ دو فرایند

در این بخش، مقایسه شاخص کارایی  $C_{pmk}$  دو فرایند را با استفاده از روش فاصله اطمینان تعمیم یافته ارائه می‌دهیم. برای این مقایسه، علاقمند به انجام آزمون فرضیه  $H_0: C_{pmk1} = C_{pmk2}$  در برابر  $H_1: C_{pmk1} \neq C_{pmk2}$  هستیم.

### ۱.۲ فاصله اطمینان تعمیم یافته

یک جامعه با تابع توزیع تجمعی  $F(x|\zeta)$  را در نظر بگیرید که  $X$  بردار متغیر تصادفی و  $(\theta, \delta) = \zeta$  بردار پارامترهای مجهول است.  $\theta$  پارامتر مورد علاقه (پارامتری که برای آن فاصله اطمینان به دست آورده می‌شود) و  $\delta$  پارامتر مزاحم است. علاقمند به یافتن برآورد فاصله‌ای برای  $\theta$  بر اساس مقادیر مشاهده شده  $X$  هستیم. برای مثال، در توزیع نرمال با میانگین  $\mu$  و واریانس  $\sigma^2$ ، پیدا کردن کمیت محوری برای توابع خطی از  $\mu$  یا  $\sigma$  مشکل نیست، اما کمیت محوری برای تابعی مثل  $\mu^2 + \sigma^2$  وجود ندارد. بنابراین، باید تعریف کمیت محوری متعارف را توسعه داد تا بتوان برآورد فاصله‌ای را به شکل کاربردی مورد استفاده قرار داد.

**تعریف ۱.۲.** فرض کنید  $R = r(X; x, \zeta)$  تابعی از  $X$  و  $\zeta$  است و می‌تواند تابعی از مقدار مشاهده شده  $x$  نیز باشد. اگر کمیت تصادفی  $R$  در دو شرط زیر صدق کند، آن‌گاه  $R$  یک کمیت محوری تعمیم یافته است:

۱. توزیع  $R$  به پارامترهای مجهول بستگی نداشته باشد.

۲. کمیت مشاهده شده  $r = r(x; x, \zeta)$  به پارامتر مزاحم  $\delta$  وابسته نباشد.

ایده فاصله اطمینان تعمیم یافته اولین بار توسط ویراهاندی<sup>۱</sup> مطرح شد. وقتی که کمیت محوری متعارف وجود نداشته باشد یا به دست آوردن آن مشکل باشد، روش فاصله اطمینان تعمیم یافته ارزش بیش‌تری خواهد داشت.

**قضیه ۲.۲.** اگر فرایند ۱ با حجم نمونه  $n_1$  و فرایند ۲ با حجم نمونه  $n_2$  به ترتیب دارای توزیع نرمال با میانگین  $\mu_1$  و  $\mu_2$  و انحراف معیار  $\sigma_1$  و  $\sigma_2$  باشد و  $R_{\mu_i}$  و  $R_{\sigma_i}$  به ترتیب کمیت‌های محوری

<sup>۱</sup>Weerahandi

تعمیم یافته برای  $\mu_i$  و  $\sigma_i^2$  باشند و به صورت زیر تعریف شوند:

$$R_{\mu_i} = \bar{x}_i - \frac{Z_i s_i}{\sqrt{U_i}} \sqrt{\frac{n_i - 1}{n_i}}, \quad i = 1, 2$$

$$R_{\sigma_i^2} = \frac{(n_i - 1) s_i^2}{U_i}, \quad i = 1, 2$$

که در آن  $Z_i = \frac{\bar{X}_i - \mu_i}{\sigma_i / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ ،  $U_i = \frac{(n_i - 1) S_i^2}{\sigma_i^2} \sim \chi_{n_i - 1}^2$ ،  $M = \frac{L+U}{2}$  می باشد، آن گاه کمیت محوری تعمیم یافته برای  $\frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  به صورت ۱ است:

$$R_{C_{pmk}} = \frac{R_{C_{pmk1}}}{R_{C_{pmk2}}}, \quad (1)$$

که در آن  $R_{C_{pmki}}$  کمیت محوری تعمیم یافته برای  $C_{pmki}$  است و به صورت زیر تعریف می شود:

$$R_{C_{pmki}} = \frac{(U - L) - |R_{\mu_i} - M|}{3 \sqrt{R_{\sigma_i^2} + (R_{\mu_i} - T)^2}}, \quad i = 1, 2.$$

**برهان.** توزیع  $R_{\mu_i}$  و همچنین توزیع  $R_{\sigma_i^2}$  به  $(\mu_i, \sigma_i^2)$  بستگی ندارند، بنابراین توزیع  $R_{C_{pmki}}$  نیز به  $(\mu_i, \sigma_i^2)$  بستگی ندارد. از طرفی  $r_{C_{pmki}} = C_{pmki}$  است، پس  $R_{C_{pmki}}$  یک کمیت محوری تعمیم یافته برای  $C_{pmki}$  است. بنابراین یک کمیت محوری تعمیم یافته برای  $\frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  به صورت زیر است:

$$R_{C_{pmk}} = \frac{R_{C_{pmk1}}}{R_{C_{pmk2}}}. \quad (2)$$

واضح است که  $r_{C_{pmk}} = \frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  است و همچنین توزیع  $R_{C_{pmk}}$  به پارامترهای مجهول بستگی ندارد، بنابراین  $R_{C_{pmk}}$  یک کمیت محوری تعمیم یافته برای  $\frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  است. □

با توجه به قضیه ۲.۲ یک فاصله اطمینان تقریبی  $(1 - \alpha) 100\%$  برای  $\frac{C_{pmk1}}{C_{pmk2}}$  عبارت است از:

$$[R_{C_{pmk}; \frac{\alpha}{2}}, R_{C_{pmk}; 1 - \frac{\alpha}{2}}], \quad (3)$$

که در آن  $R_{C_{pmk}; \frac{\alpha}{2}}$  چندانک  $\frac{\alpha}{2}$  و  $R_{C_{pmk}; 1 - \frac{\alpha}{2}}$  چندانک  $1 - \frac{\alpha}{2}$  توزیع  $R_{C_{pmk}}$  است. چون در این جا نمی توان توزیع  $R_{C_{pmk}}$  را به شکل بسته نوشت، بنابراین با استفاده از شبیه سازی چندانک ها را محاسبه می کنیم. اگر  $R_{C_{pmk}; \frac{\alpha}{2}} > 1$  یا  $R_{C_{pmk}; 1 - \frac{\alpha}{2}} < 1$  باشد، کارایی دو فرایند متفاوت است.

**مثال ۳.۲.** داده های جدول ۱ که از مرجع چن وتانگ (۲۰۰۳) گرفته شده است، مربوط به دو تأمین کننده است که فویل آلومینیوم را برای یک شرکت الکترونیکی در تایوان آماده می کنند. فویل آلومینیوم به عنوان

مؤلفه کلیدی، کیفیت باطری‌ها را تعیین می‌کند و ولتاژ نیز یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های کیفی فویل آلومینیوم است. مشخصه‌های تولید ولتاژ ( $LSL, T, USL$ )، به صورت (۵۱۰, ۵۲۰, ۵۳۰) است. اگر ولتاژ خارج از فاصله (۵۱۰, ۵۳۰) باشد، فویل آلومینیوم شکسته خواهد شد و بنابراین پذیرفته نمی‌شود. پنجاه نمونه تصادفی از تأمین‌کننده‌های ۱ و ۲ توسط بازرس کنترل کیفیت گرفته شده است. فرایند هر تأمین‌کننده تقریباً نرمال و تحت کنترل آماری است.

جدول ۱: داده‌های ولتاژ دو تأمین‌کننده برای فویل آلومینیوم. واحد اندازه‌گیری:  $WV^*$ .

تأمین‌کننده ۲					تأمین‌کننده ۱				
۵۲۲/۵	۵۲۴/۴	۵۲۳/۵	۵۲۱/۳	۵۲۱/۷	۵۲۱/۱	۵۱۷/۰	۵۲۰/۱	۵۱۹/۵	۵۱۹/۹
۵۲۴/۲	۵۲۲/۹	۵۲۴/۹	۵۲۷/۱	۵۲۳/۳	۵۲۱/۷	۵۲۱/۲	۵۲۰/۱	۵۱۸/۷	۵۱۷/۱
۵۱۸/۷	۵۱۷/۳	۵۲۷/۵	۵۲۳/۵	۵۲۳/۹	۵۱۷/۲	۵۱۷/۷	۵۲۲/۹	۵۱۷/۹	۵۲۰/۴
۵۲۰/۴	۵۲۰/۴	۵۱۹/۷	۵۲۱/۹	۵۱۸/۷	۵۱۸/۹	۵۱۸/۴	۵۱۹/۱	۵۲۱/۰	۵۲۰/۷
۵۱۷/۵	۵۲۸/۱	۵۱۷/۷	۵۲۶/۸	۵۲۳/۷	۵۲۰/۶	۵۱۹/۳	۵۲۰/۸	۵۱۸/۴	۵۱۷/۹
۵۲۶/۳	۵۱۸/۵	۵۲۲/۶	۵۱۴/۷	۵۲۳/۸	۵۱۹/۶	۵۱۷/۹	۵۲۰/۶	۵۱۹/۰	۵۱۶/۶
۵۲۰/۴	۵۱۹/۶	۵۲۲/۷	۵۲۴/۴	۵۲۳/۲	۵۲۳/۱	۵۲۲/۱	۵۱۸/۳	۵۲۲/۶	۵۱۹/۶
۵۲۲/۲	۵۱۹/۳	۵۲۴/۱	۵۲۵/۲	۵۲۰/۶	۵۲۱/۵	۵۱۶/۵	۵۲۰/۷	۵۱۹/۸	۵۱۹/۹
۵۲۵/۲	۵۲۰/۹	۵۱۶/۷	۵۲۱/۹	۵۲۰/۱	۵۲۱/۳	۵۱۷/۸	۵۱۸/۹	۵۲۱/۲	۵۱۹/۲
۵۲۶/۳	۵۲۰/۹	۵۲۱/۷	۵۲۳/۱	۵۲۲/۶	۵۲۳/۸	۵۲۲/۰	۵۱۹/۵	۵۱۷/۴	۵۲۱/۳

\* حداکثر مقدار ولتاژ خازن را ولتاژ کار خازن یا Working Voltage می‌نامند.

فاصله اطمینان تعمیم‌یافته  $(1-\alpha) 100\%$  برای نسبت  $C_{pmk}$  دو فرایند عبارت است از  $(1/522, 2/591)$  که نشان می‌دهد فرایند ۱ کاراتر از فرایند ۲ است. فاصله اطمینان برای نسبت  $C_{pmk}$  دو فرایند نیز به صورت  $(1/741, 3/387)$  به دست می‌آید که بیانگر کاراتر بودن فرایند ۱ نسبت به فرایند ۲ است.

## بحث و نتیجه گیری

کمیت محوری تعمیم یافته و فاصله اطمینان تعمیم یافته ابزار بسیار مفیدی برای استنباط در مورد مسایل آمار صنعتی می باشند. شاخص های کارایی فرایند کمیت های با اهمیتی هستند که برای تعیین کارایی فرایند محصولات تولیدی استفاده می شوند. فاصله اطمینان ارائه شده در این مقاله می تواند برای مقایسه شاخص کارایی چندین فرایند و یا مقایسه های زوجی تعمیم داده شود.

## مراجع

- [1] Chen, J. P. and Tong, L. I., (2003), Bootstrap confidence interval of the difference between two process capability indices, *Int J Adv Manuf Technol*, **21**:249-256.
- [2] Kanichukattu, J. K. and Luke, J. A., (2013), Comparison between two process capability indices using generalized confidence intervals, *Int J Adv Manuf Technol*.
- [3] Kotz, S. and Johnson, N. L., (1993), *Process capability indices*. Chapman and Hall, London.
- [4] Kotz, S. and Lovelace, C. R., (1988), *Process Capability Indices in Theory and Practice*, Arnold, London.
- [5] Montgomery, D. C., (2005), *Introduction to Statistical Quality Control*, Wiley, New York, 6th ed.
- [6] Pearn, W. L. and Kotz, S., (2006), *Encyclopedia and Handbook of Process Capability Indices*, World Scientific, Vol. 12.
- [7] Weerahandi, S., (1995), *Exact statistical methods for data analysis*, Springer, New York.